



中华人民共和国国家标准

GB/T 17473.6—1998

厚膜微电子技术用贵金属浆料 测试方法 分辨率测定

Test methods of precious metal pastes
used for thick film microelectronics
—Determination of resolution

1998-08-19 发布

1999-03-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

贵金属浆料是厚膜微电子技术领域的一种重要材料,分辨率是浆料的主要性能之一。目前我国尚未制定出浆料分辨率测试方法的标准,也未检索到该测试方法的国际标准或国外先进标准。

本标准主要参照日本标准 JIS C5010《印刷线路板规则》及相关资料,结合我国贵金属浆料生产与应用实践而制定的。

本标准由中国有色金属工业总公司提出。

本标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所归口。

本标准由昆明贵金属研究所负责起草。

本标准主要起草人:张林震。